

## 第31回分析センターワークショップ

# 物性測定の前線

【日時】 2018/6/26 (火) 10:00-12:00 セミナー (申込必要)  
13:00-17:00 実サンプル測定 (申込必要)  
6/27 (水) 9:00-15:00 実サンプル測定 (申込必要)  
【場所】 九州大学伊都キャンパス・ウエスト3号館1階101室 (セミナーは209室)  
【主催】 九州大学中央分析センター  
【協力】 大塚電子株式会社、正晃株式会社

### 物性測定ワークショップ 開催します。

本ワークショップは、大塚電子株式会社、正晃株式会社と伊都地区中央分析センターのコラボ企画です。ゼータ電位、粒径、分子量測定と各種膜厚測定ができる装置を展示します。お気軽にご参加ください。

6/26 (火) は、デモ測定に先立ちセミナーを開催します。

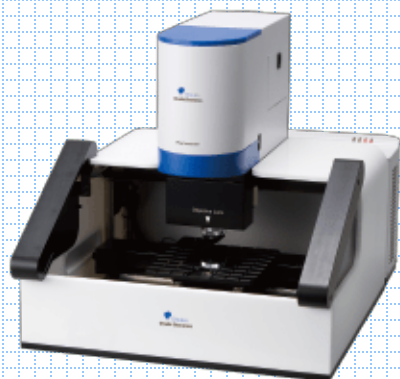
#### 10:00-11:00 顕微分光膜厚計 OPTMを中心とした膜厚測定システムのご紹介

各種用途や膜厚範囲に対応する膜厚計のラインナップをその原理から特徴・測定事例をご紹介します。

#### 11:00-12:00 光散乱による粒子径・ゼータ電位測定の原理と応用(電池、バイオ分野など)

微粒子の分散凝集評価に最適な光散乱による粒子径・ゼータ電位測定の原理と展示機種(ELSZ-2000)を使用した電池、バイオ関連をメインとしたアプリケーションをご紹介します。

実サンプル測定が可能な機器です。



#### 顕微分光膜厚計 OPTM-A1

顕微分光を用いた微小領域での絶対反射率測定により、高精度な膜厚・光学定数解析が可能な装置です。各種フィルムやウェーハ、光学材料などのコーティング膜の厚みや多層膜を非破壊・非接触で測定できます。測定時間は1秒/pointの高速測定が可能で初めての方でも簡単に光学定数の解析ができるソフトウェアを搭載しています。

波長範囲：230～800nm  
膜厚範囲：1nm～35um  
サンプルサイズ：Max.200mm×200mm×17mm



#### ゼータ電位・粒径・分子量測定システム ELSZ-2000ZS

従来からの希薄溶液～濃厚溶液でのゼータ電位・粒子径測定に加え分子量測定も可能な装置です。粒子径測定範囲(0.6nm～10um)濃度範囲(0.00001%～40%)に対応。電気浸透流を実測し、高精度なゼータ電位測定を可能とした最小容量130μL～のディスプレイセルで測定が可能です。また新たに0～90℃の幅広い温度範囲で、自動温度グラジエント測定をおこない変性・相転移温度解析が可能です。

#### 【申込要領】

サンプル測定・セミナー参加を希望される場合は、エクセルファイルに必要事項を記入してお申し込みください。研究室からの人数制限はありません。機器見学の方は申込の必要はありません。時間内にお出でください。

申込先： 中央分析センター伊部分室・渡辺 092-802-2857  
watanabe.midori.452@m.kyushu-u.ac.jp